4 スパン安定性に係る試験	十四万四千三百円
5 放射無線周波電磁界イミュニティ試験	十二万千三百円
6 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験	五万四千四百円
7 サージイミュニティ試験	三万八千六百円
8 5から7までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験	七万五千五百円
9 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験	八万二千七百円

中欄2及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十一万六千七百円とする。

中欄2及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十二万七千百円とする。

(2) ひょう量が二トンを超えるもの	
1 アナログロードセルの性能に係る試験	三十四万千八百円
2 デジタルロードセルの性能に係る試験	五十六万九千二百円
3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験	四十二万九千三百円
4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の性能に係る試験	二十万二千八百円

［削る］

［削る］

ロ 自動捕捉式はかり	
1 温湿度の影響に係る試験	三十七万六千七百円
2 供給電源の影響に係る試験	十四万千円
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験	六十七万二千百円

［新設］

［新設］

［新設］

［新設］

中欄2及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十一万六千七百円とする。

中欄2及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十二万七千百円とする。

ロ ひょう量が二トンを超えるもの	
1 アナログロードセルの性能に係る試験	三十四万千八百円
2 デジタルロードセルの性能に係る試験	五十六万九千二百円
3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験	四十二万九千三百円